

高周波膜厚計



料金表コード	D30
機器名	高周波膜厚計
メーカー名	(株)ケツト科学研究所
型式	LH-300C
取得年月	1997/3
仕様	測定範囲 0~800 μ m 測定精度 50 μ m未満: $\pm 1.0 \mu$ m(絶対誤差), 50 μ m以上: $\pm 3\%$ (相対誤差)

用途・使用例

非磁性金属上の絶縁被膜厚の測定

素 地: アルミニウム、銅、真鍮、ステンレス(非磁性)
測定被膜: 塗装、プラスチック、ラッカー、樹脂、ゴム、
陽極酸化皮膜(アルマイト)、レジスト など